	36.625GHzから48.10GHzまで
	48.10GHzから48.50GHzまで
	48.50GHzから52.00GHzまで
	52.00GHzから52.50GHzまで
	52.50GHzから58.00GHzまで
分解能帯域幅	１MHz
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅の３倍程度
Ｙ軸スケール	10dB／Div
入力レベル	最大のダイナミックレンジとなる値
掃引時間	測定確度が保証される最小時間（注３）
データ点数	400点以上
掃引モード	連続掃引（波形の変動がなくなるまで）
検波モード	ポジティブピーク
表示モード	マックスホールド

⑶　ゼロスパンで算出する場合は、不要発射振幅測定時のスペクトル分析器を次のように設定する。

中心周波数	不要発射周波数（検出した周波数）
掃引周波数幅	０Hz
分解能帯域幅	１MHz
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅の３倍程度
Ｙ軸スケール	10dB／Div
入力レベル	送信信号の振幅をミキサの直線領域の最大付近
掃引時間	測定確度が保証される最小時間（バースト波の場合は、１バースト時間内にデータ点数が10以上となること）
データ点数	400点以上
掃引モード	単掃引
検波モード	ポジティブピーク

3　試験機器の状態

⑴　試験周波数に設定し、送信する。

⑵　試験機器を外部変調信号発生器又は内蔵の変調信号により、通常の使用状態における変調状態に設定して連続送信状態とする。

⑶　⑵の設定が困難な場合は、バースト送信状態で測定するときは、電波を発射している時間が最大となる送信状態とする。

4　測定操作手順

⑴　スペクトル分析器の設定を２⑵とし、掃引して不要発射を探索する。この場合は、指定周波数帯等（注２）の範囲を探索範囲から除外する。

⑵　検出した不要発射の振幅値が、尖頭電力の許容値に対し３dB以上低い場合は、尖頭電力の測定値とする。許容値に対し３dB以上低い値を超えた場合は、周波数の確度を高めるため、２⑵において掃引周波数幅を100MHz、10MHzと順次狭くして、その不要発射周波数及び不要発射の値を正確に算出し尖頭電力の測定値とする。

⑶　検出した不要発射の振幅値（尖頭電力）が次の周波数範囲において許容値以下の場合は、その値を測定値とする。許容値を超えた場合は、⑷以下の測定を行う。

周波数範囲	許容値
48.10GHz以上48.50GHz以下	－44dBm／MHz
52.00GHz以上52.50GHz以下	－44dBm／MHz

⑷　スペクトル分析器の設定を２⑵において、掃引周波数幅を48.1GHzから48.5GHzまで及び52.0GHzから52.50GHzまでとして掃引し、不要発射を探索する。

⑸　検出した不要発射の振幅値が、許容値（－44dBm／MHz）を超える周波数を記録する。２⑵において、許容値を超えた周波数を中心周波数として、掃引周波数幅を100MHz、10MHzと順次狭くして、許容値を超える不要発射周波数及び不要発射の値を算出する。

⑹　⑸において許容値を超えた周波数が48.1GHzから48.5GHzまで及び52.0GHzから52.5GHzまでのそれぞれの帯域内で最大のものから６波（６波以下の場合は、許容値を超える周波数全て）までの周波数について、スペクトル分析器の設定を２⑶とし、分解能帯域幅を１MHz、ビデオ帯域幅を３MHzとして掃引し、最大値を測定値とする。

⑺　複数の空中線を有する場合は、それぞれの空中線ごとに測定する。

5　試験結果の記載方法

⑴　技術基準の許容値が異なる帯域ごとに不要発射電力の尖頭電力及び平均電力の最大値の１波をdBm／MHz単位で、周波数とともに記載する。

⑵　48.1GHz以上48.5GHz以下において－44dBm／MHzを超えた不要発射については、dBm／MHz単位で、周波数とともに記載する。

⑶　52.0GHz以上52.5GHz以下において－44dBm／MHzを超えた不要発射については、dBm／MHz単位で、周波数とともに記載する。

⑷　複数の空中線を有する場合は、それぞれの空中線ごとの測定値において各周波数ごとにおける総和をdBm／MHz単位で周波数とともに記載するほか、参考としてそれぞれの空中線ごとに最大の１波をdBm／MHz単位で、周波数とともに記載する。

6　その他

⑴　スペクトル分析器は、内部で高調波歪みや相互変調積が発生し試験機器から発射されていない不要発射を記載する場合がある。測定時に必要とされるダイナミックレンジが得られないスペクトル分析器の場合は、これを改善するため搬送波（基本波）を抑圧するフィルタが必要となる。

⑵　搬送波抑圧フィルタを使用する場合は、フィルタの減衰領域及び減衰領域近傍の不要発射測定において、フィルタによる減衰量を補正する。

⑶　擬似負荷は、特性インピーダンス50Ωの減衰器を接続して行うこととする。ただし、測定レベルが低いため、スペクトル分析器の内蔵減衰器を用いる場合は、擬似負荷を用いない等レベルダイヤを最適化する。

⑷　使用するスペクトル分析器の雑音レベルが不要発射の許容値のレベルを超えて直接測定できない場合は、低雑音増幅器等を使用するとともに、接続ケーブルの損失等も最小となるように注意し、測定系の雑音レベル（尖頭値）を不要発射の尖頭電力の許容値より６dB以上低い値とする。なお、許容値より10dB以上低い値とすることが望ましい。

⑸　使用するスペクトル分析器の上限周波数が不足し、外部ミキサを用いる場合や同軸導波管変換器を用いる場合も、測定系の雑音レベル（尖頭値）を⑷と同様とする。

⑹　不要発射探索時の掃引周波数幅は、２⑵において技術基準の許容値が異なる帯域ごとに掃引する。ただし、データ点数が十分確保でき不要発射を欠測するおそれがなく、許容値が変わる周波数領域において疑義が生じない十分な分解能を有するスペクトル分析器を用いる場合は、掃引周波数幅を広くして測定することができる。

⑺　２⑶において、不要発射のバースト時間が不明な場合は、掃引モードを連続、表示モードをマックスホールドに設定し、最大値を測定値とする。

⑻　試験機器との接続機器としては、58GHzまで測定可能な同軸型コネクタ（1.85㎜）を用いることが望ましい。なお、異なるコネクタを用いる場合は、変換コネクタ等により1.85㎜コネクタに変換する。